

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



## СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации  
топологии интегральной микросхемы

№ 2009630003

Топология тестового кристалла для экспериментальной  
проверки базовой технологии изготовления микропотребляющих  
СБИС на объемном кремнии

Правообладатель(ли): *Государственное учреждение  
«Научно-производственный комплекс «Технологический центр»  
Московского государственного института  
электронной техники» (RU)*

Автор(ы): *Басаева Татьяна Сергеевна,  
Кузнецов Евгений Васильевич (RU)*

Заявка № 2008630058

Дата поступления 11 декабря 2008 г.

Зарегистрировано в Реестре топологий  
интегральных микросхем 3 февраля 2009 г.

Дата начала срока действия исключительного права  
3 февраля 2009 г.



*Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной  
собственности, патентам и товарным знакам*

*Б.П. Симонов*